



中国科学院上海硅酸盐研究所
Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences

创新引领 服务国家 造福人民
——中国科学院陶瓷所使命

([//www.sic.cas.cn/](http://www.sic.cas.cn/))

当前位置: 首页 ([//www.sic.cas.cn/](http://www.sic.cas.cn/)) > 专利库

专利数据


专利名称: 一种测量物体内部缺陷尺寸的方法
专利类别: 发明
专利(申请)号: 201910080527.2
申请日期: 2019/1/28
第一发明人: 杨晓
其他发明人: 刘桂玲, 刘学建, 杨金晶, 姚秀敏, 黄政仁, 陈忠明, 陈健
专利授权日期: 20221014



([//api.cas.cn/app/sitema/query/index.htm?//www.sic.cas.cn/](https://api.cas.cn/app/sitema/query/index.htm?//www.sic.cas.cn/))



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=08C16230D2A076FCE053012819AC8C82>)

版权所有 中国科学院上海硅酸盐研究所 沪ICP备05005480号-1 ([//beian.miit.gov.cn/](http://beian.miit.gov.cn/))  沪公网安备31010502006565号
([//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31010502006565](http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31010502006565))

长宁园区地址：上海市长宁区定西路1295号 电话：86-21-52412990 传真：86-21-52413903 邮编：200050

嘉定园区地址：上海市嘉定区和硕路585号 电话：86-21-69906002 传真：86-21-69906700 邮编：201899

